



T1120

### **COMPARAÇÃO DE INCERTEZAS DETERMINADAS EM BLOCOS PADRÃO COM DIVERSOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO”**

Hugo Bernardes Borssato (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Olívio Novaski (Orientador), Faculdade de Engenharia Mecânica - FEM, UNICAMP

O presente trabalho tem como objetivo a análise da confiabilidade de um sistema otimizado para leituras em microscópios. Para isso pretende-se mensurar vários blocos-padrão, em distintos sistemas de medição (máquina tridimensional, microscópio convencional e otimizado), com dimensões nominais variando de 5 a 100 mm – incrementos de 5 mm. Tal sistema otimizado foi proposto por Prado, que em seu trabalho procurou, principalmente, analisar a ergonomia deste sistema. O sistema de otimização baseia-se no acoplamento de uma câmera com sensor de imagem CCD (Charge Coupled Device) – Watec Wat-902 A preto e branco - e com boa resolução ao visor óptico do microscópio, que conectados a um monitor – Hitachi Professional preto e branco – de imagem também de alta resolução, possibilita uma melhor visualização das leituras dos valores obtidos na escala do microscópio. Através de medições de blocos padrão grau 0 aferidas em diferentes sistemas de medição (microscópio convencional, microscópio otimizado e máquina tridimensional), pretende-se comparar as incertezas destes sistemas de medição e concluir se o sistema de otimização para leituras em microscópios proposto por Prado é viável do ponto de vista metrológico.

Blocos-padrão - Incertezas - Medição